(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 22. Januar 2004 (22.01.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/008154 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: 1/40, B01F 11/00, 13/06

G01N 35/02,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2003/007653

(22) Internationales Anmeldedatum:

15. Juli 2003 (15.07.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

(30) Angaben zur Priorität:

102 32 202.3 16. Juli 2002 (16.07.2002)

Deutsch

DE

(71) Anmelder und

(72) Erfinder: HERZ, Helmut [DE/DE]; Bruckmannring 28, 85764 Oberschleissheim (DE). KAUFMANN, Klaus [DE/DE]; Bruckmannring 28, 85764 Oberschleissheim

(74) Anwalt: KUHNEN & WACKER; Prinz-Ludwig-Str. 40A, 85354 Freising (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

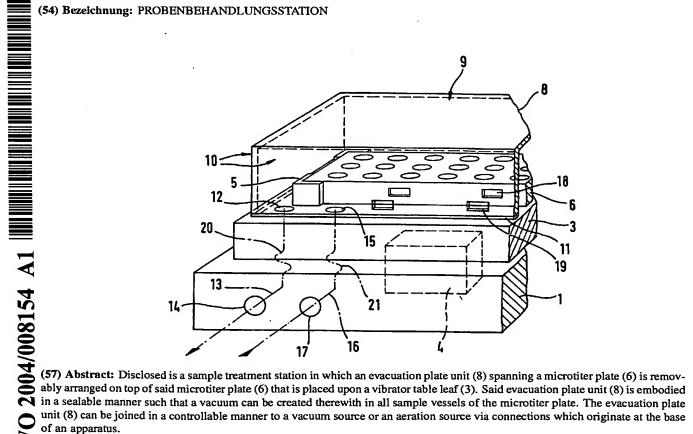
Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: SAMPLE TREATMENT STATION

(54) Bezeichnung: PROBENBEHANDLUNGSSTATION



unit (8) can be joined in a controllable manner to a vacuum source or an aeration source via connections which originate at the base of an apparatus.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Es wird eine Probenbehandlungsstation, bei welcher über einer Mikrotiterplatte (6), die auf eine Schütteltischplatte (3) aufgesetzt wird, eine die Mikrotiterplatte (6) überspannende Evakuierplatteneinheit (8) abnehmbar angeordnet, die so abdichtbar ausgebildet ist, dass sie in allen Probenbehältnissen der Mkrotiterplatte ein Vakuum zu erzuegen gestattet. Die Evakuierplatteneinheit (8) ist über Anschlüsse, welche von einer Gerätebasis ausgehen, steuerbar mit einer Vakuumquelle bzw. einer Belüftungsquelle verbindbar.

Beschreibung

Probenbehandlungsstation

Die Erfindung betrifft eine Probenbehandlungsstation, welche folgendes enthält:

eine Gerätebasisplatte;

eine gegenüber dieser vertikal abgestützten und in einer Horizontalebene beweglichen Schütteltischplatte;

einem zwischen diesem beiden Platten angeordneten und mit ihnen gekoppelten Schüttelantrieb zur Horizontalbewegung der Schütteltischplatte im wesentlichen ausschließlich translatorisch, mit Mitteln zur Stillsetzung der Schütteltischplatte in einer präzisen Ruhestellung;

einer auf der Schütteltischplatte vorgesehenen Mikrotiterplattenhalterung; und

20

15

einer in die Halterung entnehmbar eingesetzten, eine Vielzahl von Probenbehältnissen aufweisenden Mikrotiterplatte, deren Probenbehältnisse mittels einer automatisch betätigten Befüllungs- und Entnahmeeinrichtung mit Proben befüllbar bzw. entleerbar sind.

25

Probenbehandlungsstationen dieser Art sind aus der deutschen Gebrauchsmuster-schrift 200 18 633.7 an sich bekannt.

10

15

20

Zum besseren Verständnis der Erfindung seien folgende allgemeine Betrachtun-gen vorausgeschickt.

In der Pharma-Forschung, der chemischen Synthese von Wirkstoffen, in der Mi-krobiologie, der Züchtung von Zellen in Nährlösungen, bei der Analyse beispielsweise von Blut oder Gewebeproben und dergleichen, besteht seit Jahren der Trend zu immer geringeren Probemengen und der Parallelverarbeitung einer grö-Ber werdenden Zahl von unterschiedlichen Einzelproben unter in engen Grenzen gleichen Bedingungen. Die Handhabung dieser großen Zahl von Einzelproben wurde durch den Einsatz von Pipet-tier-Roboter-Stationen, von Positionierungs-Robotern, von vollautomatischen Analyse-Systemen und der Entwicklung der zugehörigen Software ermöglicht. Die Außen-abmessungen von Probenbehältniseinheiten, sogenannten Mikrotiterplatten, wurden im Zuge der Vereinheitlichung von Probenbehandlungsmethoden standardisiert. Die Mi-krotiterplatten haben je nach Bedarf 24 Probenbehältnisse im Milliliter-Bereich oder 96 Probenbehältnisse im 100-Mikroliter-Bereich oder 384 Probenbehältnisse im 10-Mi-kroliter-Bereich oder gar 1536 Probenbehältnisse im Mikroliter-Bereich. Bei den Mi-krotiterplatten handelt es sich zum größten Teil um Kunststoff-Einwegartikel, nachdem ihre Sterilisierung oder vollständige Reinigung zur Wiederverwendung nur schwer zu erreichen ist.

Eine der wichtigsten Behandlungsmaßnahmen stellt die gute Durchmischung der Proben in den einzelnen Behältnissen dar, welche um so schwieriger wird, je geringer das Probenvolumen ist.

25

Eine weitere sehr wichtige Behandlungsmaßnahme ist auch die Wärmebehand-lung der Proben in den Probenbehältnissen jeweils unter weitestgehend gleichen Bedin-gungen, also das entweder wahlweise oder in bestimmter Folge durchgeführte Erwär-men, Abkühlen oder Temperieren der Proben, sowie das Aufkon-

zentrieren durch Ab-dampfenlassen einer Suspensionsflüssigkeit oder eines Lösungsmittels, was ebenfalls unter weitestgehend gleichen Bedingungen in den einzelnen Probenbehältnissen zu geschehen hat.

Um wäßrige oder andersartige Suspensionsflüssigkeiten und wäßrige oder anders-artige Lösungsmittel zu verdampfen und die in Suspension vorliegenden Inhaltsstoffe oder die gelösten Inhaltsstoffe zu konzentrieren, hat man bisher im wesentlichen zwei unterschiedliche Verfahren angewendet, nämlich das Sieden der Proben unter Zufuhr von Heizleistung und das Anblasen der Proben mit Luft oder Inertgas zur Beschleuni-gung der Verdunstung.

5

10

15

20

25

Oft liegen Inhaltsstoffe vor, die beim Sieden unter Normaldruck (etwa 100°C bei wäßrigen Suspensions- oder Lösungsmitteln) zerstört werden, weshalb ein schonendes Aufkonzentrieren etwa durch Anblasen mit Luft zur Beschleunigung der Verdunstung bevorzugt wird.

Es ist jedoch auch die Methode bekannt, die Proben in einer Vakuumkammer sie-den zu lassen, derart, daß beispielsweise wäßrige Suspensions- oder Lösungsmittel bei einem Druck von 20 mbar bei etwa 20°C sieden. Hierbei besteht jedoch das Problem einer Blasenbildung und eines Siedeverzugs, was unausweichlich zu einem Überkochen der Proben in den Probenbehältnissen über den Behältnisrand hinaus und zu einem Schäumen der Probe führt. Dieser Erscheinung versuchte man durch die Probenbe-handlung in einer Zentrifuge zu begegnen, da bei geeigneten Beschleunigungen aufstei-gende Blasen zerplatzen oder aufgrund des Schwerefeldes die aufsteigenden Blasen in der Probe klein bleiben.

Es zeigt sich jedoch, daß die einzelnen Probenbehandlungsmaßnahmen an in die Probenbehältnisse von Mikrotiterplatten eingefüllten Proben, nämlich das Durchmi-schen durch »Sehütteln, verschiedene Wärmebehandlungsmaßnahmen,

10

15

20

das Aufkonzen-trieren und beispielsweise auch das Separieren von Inhaltsstoffen durch Magnetperlen-behandlung und dergleichen, bisher eine Reihe von Probenbehandlungsstationen erfor-derlich machten, welche entweder von Hand oder durch eine Mehrzahl von Roboter-Manipulatoren zu bedienen waren und demgemäß einen großen Platzaufwand und Ko-stenaufwand bedingten.

Durch die Erfindung soll die Aufgabe gelöst werden, eine Probenbehandlungssta-tion der eingangs definierten Art so auszugestalten, daß an einem Ort und
mit einer Ge-räteeinheit die in die Probenbehältnisse einer Mikrotiterplatte eingefüllten Proben nicht nur durch Schütteln intensiv durchmischt, sondern auch einer
Vakuumbehandlung un-terzogen werden können, ohne daß die Mikrotiterplattenhandhabung und die automati-sche Probenbefüllung und Probenentnahme, beispielsweise durch eine Roboter-Pipet-tiereinrichtung behindert oder unmöglich
gemacht wird, und ferner, ohne daß die betref-fende Mikrotiterplatte durch mehrere unterschiedliche Behandlungsstationen geführt werden muß.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst, wobei also über der Mikrotiterplatte eine diese überspannende Evakuierplatten-einheit abnehmbar angeordnet ist, die so abdichtbar ausgebildet ist, daß sie in allen Probenbehältnissen der Mikrotiterplatte ein Vakuum zu erzeugen gestattet, und die über Anschlüsse der Gerätebasisplatte steuerbar mit einer Vakuumquelle bzw. einer Belüf-tungsquelle verbindbar ist.

Der einer Bahandlungsstation der hier angegebenen Art zugrunde liegende

Kon-struktionsgedanke sieht vor, die Behandlungsstation aus einem über der Gerätebasis und/oder der Schütteltischplatte aufgebauten Stapel von plattenartigen Geräteeinheiten aufzubauen, die sämtlich an ihrem Rand mit Eingriffselementen zur Zusammenwirkung mit dem Manipulator eines einzigen Roboters versehen sind und in gewünschter Aus-wahl aufstapelbar bzw. voneinander trennbar sind,

wobei einzelne plattenartige Geräte-einheiten mit Dichtungen zur Randabdichtung gegenüber den benachbarten plattenarti-gen Geräteeinheiten sowie auch mit Dichtungen zur Abdichtung von Durchführungska-nalanordnungen versehen sind und diese Dichtungen in erster Linie durch Wirksamwer-den eines Vakuums zwischen den plattenartigen Geräteeinheiten ihre Abdichtwirkung entfalten und bei Belüftung der Vakuumräume ein einfaches Lösen der zuvor abge-dichteten plattenartigen Geräteeinheiten voneinander ermöglichen.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Probenbehandlungsstation der hier angegebenen Art sind in den dem anliegenden Anspruch 1 nachgeordneten Pa-tentansprüchen gekennzeichnet, deren Inhalt hierdurch ausdrücklich zum Bestandteil der Beschreibung gemacht wird, ohne an dieser Stelle den Wortlaut zu wiederholen.

Zwar sind diese Ansprüche, wie soeben gesagt, dem Anspruch 1 nachgeordnet, doch beinhalten sie durchaus Merkmale und Merkmalskombinationen, die unabhängig von den Merkmalen des Anspruches 1 von selbständiger erfinderischer Bedeutung sind, worauf in der nachfolgenden Beschreibung im Einzelnen eingegangen wird.

20

25

5

10

15

Nachfolgend wird die Erfindung anhand einiger Ausführungsformen unter Bezug-nahme auf die Zeichnung beschrieben, in welcher:

Fig. 1 eine schematische perspektivische, ausschnittsweise

Darstellung einer Probenbehandlungsstation der hier

betrachteten allgemeinen Art ist, wobei die Mikrotiterplatte

von der Schütteltischplatte abgehoben dar-gestellt ist;

	Fig. 2	eine perspektivische, schematisch ausschnittsweise
		Darstellung einer ersten Ausführungsform der Erfindung ist;
·	Fig. 3	eine zweite Ausführungsform einer
5		Probenbehandlungsstation der hier angegebenen Art in
		ähnlicher Darstellungsweise wie in Fig. 2 wieder-gibt;
		, û partir de
g-dancadesa, p.,	Fig. 4	eine dritte Ausführungsform einer Probenbehandlungsstation
		der hier angegebenen Art in ähnlicher Darstellungsweise wie
10		Fig. 2 und Fig. 3 zeigt;
	Fig. 5A	i jiga antiqui inga an
	und 5B	schematisierte Vertikalschnittdarstellungen des linken Teiles
	und 3D	bzw. des rechten Teiles einer Weiterbildung einer
15		Probenbehandlungsstation der grundsätzlichen Konstruktion
13		nach Fig. 2 zeigen;
ba- ,		
· Sergifige as	Fig. 6	eine perspektivische schematische, ausschnittsweise
		Darstellung einer Einzelheit einer Probenbehandlungsstation
20		der hier angegebenen Art wiedergibt, wobei diese Einzelheit
		als Weiterbildung in Probenbe-handlungsstationen nach den
		Fig. 2 bis 5B vorgesehen sein kann; und
,		
	Fig. 7	eine schematische ausschnittsweise
25		Vertikalschnittdarstellung einer Probenbehandlungsstation
		der hier angegebenen Art in der grundsätz-lichen
×4.		Ausbildung gemäß Fig. 4 mit einer Reihe von Weiter-
		bildungen und Ergänzungen zur Durchführung zusätzlicher
		Behandlungsmaß-nahmen.

Fig. 1 zeigt eine Probenbehandlungsstation mit einer Gerätebasisplatte 1, über welcher durch eine Schwenkstützenkonstruktion mit einer Reihe von der Gerätebasis-platte 1 aufragenden Schwenkstützen, von denen in Fig. 1 eine bei 2 schematisch angedeutet ist, eine gegenüber der Gerätebasisplatte 1 vertikal abgestützte und in einer Horizontalebene bewegliche Schütteltischplatte 3 angeordnet ist. Zwischen der Geräte-basisplatte und der Schütteltischplatte befindet sich ein elektromagnetischer Schüttelan-trieb 4 zur Horizontalbewegung der Schütteltischplatte 3 im wesentlichen ausschließlich translatorisch gegenüber der Geräteplatte 1. Der Schüttelantrieb 4, beispielsweise zur Erzeugung kreisförmiger translatorischer Bewegungen der "Schütteltischplatte 3 gegen-über der Gerätebasis 1, kann, wie in der bereits zuvor erwähnten deutschen Gebrauchsmusterschrift 200 18 633.7 beschrieben ist, ausgebildet sein, so daß sich eine ins einzelne gehende Beschreibung des Schüttelantriebs 4 hier erübrigt.

15

20

25

10

5

Bedeutsam ist jedoch, daß beispielsweise durch besondere Ausbildung der Schwenkstützen 2 oder durch federbelastete Indexstifte, die zwischen der Gerätebasis-platte 1 und der Schütteltischplatte 3 wirksam sind, oder auch durch eine in bestimmter Weise gesteuerte Erregung des elektromagnetischen Schüttelantriebs 4 während eines Ruhezustandes, dafür Sorge getragen ist, daß die Schütteltischplatte in einer präzisen Ruhestellung gegenüber der Gerätebasisplatte stillgesetzt wird, sobald die Schüttelbe-wegungen der Schütteltischplatte beendet sind. Die Bedeutsamkeit der Mittel zum Still-setzen der Schütteltischplatte in einer präzisen Ruhestellung ergibt sich aus der Notwendigkeit der automatischen Befüllung und Entleerung einer Vielzahl von Probenbehältnissen mittels einer roboterbetätigten Pipettiereinrichtung, deren Pipetten auf die präzise positionierten Behältnismündungen treffen müssen.

Auf der Schütteltischplatte 3 befindet sich eine Mikrotiterplattenhalterung 5 in Gestalt von am Rand der Schütteltischplatte 3 angeordneten Haltewinkeln, die nahe den Ecken der Schütteltischplatte angeordnet sind und zwischen sich eine Haltefläche definieren, über der eine Mikrotiterplatte 6 durch Einsetzen zwischen die Haltewinkel der Mikrotiterplattenhalterung positioniert werden kann. Die Mikrotiterplattenhalterung kann mit Rastmitteln auf der nach einwärts weisenden Seite der Haltewinkel oder mit elastisch nachgiebigen Wänden dieser Haltewinkel ausgestattet sein, um die Mikrotiter-platte 6 gegen einen bestimmten Reibungswiderstand oder Rastwiderstand auf die Schütteltischplatte 3 aufsetzen zu können und gegen die genannten Widerstände, bei-spielsweise mittels des Manipulators eines Rotors, von der Schütteltischplatte 3 abheben zu können.

Die Mikrotiterplatte 6 weist eine Vielzahl von Probenbehältnissen 7 auf, deren In-nenraum mittels einer automatisch betätigten Befüllungs- und Entnahmeeinrichtung, beispielsweise einer Pipettiereinrichtung mit einer Vielzahl von Befüllung- und Ent-nahmepipetten, mit Proben befüllbar bzw. nach Behandlung wieder enleerbar sind. Die roboterbetätigte und in ihrer Funktion rechnergesteuerte Pipettiereinrichtung ist in der Zeichnung aus Übersichtlichkeitsgründen nicht dargestellt, dem Fachmann jedoch auf diesem Gebiete bekannt.

20

25

15

5

10

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Probenbehandlungsstation der anhand von Fig. 1 beschriebenen allgemeinen Art. Es sei hier bemerkt, daß die in der Zeichnung gewählten Größenverhältnisse und Abmessungen keinen Anspruch auf Maßstäblichkeit erheben und daß insbesondere auch die Lage und Querschnittsdimensionierung von Zuleitungen und Ableitungen für Wärmetauschmittel, Dämpfe oder Gase in der Zeich-nung mitunter aus Darstellungsgründen an bestimmten Orten, insbesondere mit Bezug auf die Aufsicht, einzelner plattenartiger Geräteeinheiten gewählt ist, praktisch jedoch in einer Aufsicht der betreffenden plattenförmigen Geräteeinheit auch weit auseinanderlie-gend gewählt sei kann.

10

15

20

25

Fig. 2 zeigt eine erste Ausführungsform einer Probenbehandlungsstation der hier angegebenen Art mit dem grundsätzlichem Aufbau gemäß Fig. 1, wobei wiederum eine Gerätebasisplatte 1, ein mit dieser und einer Schütteltischplatte 3 gekoppelter Schüt-telantrieb 4 und ein auf die Schütteltischplatte 3 abnehmbar aufgesetzte Mikrotiter-platte 6 vorgesehen sind.

Über der Mikrotiterplatte 6 befindet sich eine diese überspannende Evakuierplat-teneinheit 8 in Gestalt einer Haube, die eine Deckplatte 9 sowie an diese einstückig anschließende seitliche Wände 10 aufweist, deren unterer Rand gegenüber der gasdicht zur Umgebung hin ausgebildeten Gerätebasisplatte 1 über eine rundumlaufende Dicht-leiste 11 dicht abgeschlossen ist, wenn die Evakuierplatteneinheit 8 über die Schüttel-tischplatte 3 und die Mikrotiterplatte 6 gestülpt ist.

Im Bereich des Randes der nach oben weisenden Fläche zwischen der gegenüber den Gerätebasisplatte 1 zurückgesetzten Schütteltischplatte 3 und den Innenwänden der Evakuierplatteneinheit 8 befinden sich eine Mündungsöffnung 12 eines durch die Gerä-tebasisplatte 1 geführten Evakuierkanales 13, über den die Gerätebasisplatte 1 mittels eines schematisch angedeuteten Anschlusses 14 mit einer Vakuumpumpe verbindbar ist, sowie ferner eine Mündungsöffnung 15 eines durch die Gerätebasisplatte 1 geführten Belüftungskanal 16, über den die Gerätebasisplatte 1 mittels eines Anschlusses 17 mit einer Belüftungseinrichtung verbindbar ist. Im Leitungszug zur Vakuumquelle oder Va-kuumpumpe und zu der Belüftungsquelle können Steuermittel und Meßeinrichtungen vorgesehen sein, welche in Fig. 2 zur Vereinfachung der Darstellung nicht gezeigt sind.

An den Seitenrändern der Mikrotiterplatte 6 befinden sich in Fig. 2 schematisch angedeutete Angriffsorgane zur Zusammenwirkung mit einem Roboter-Manipulator, wobei diese Angriffsorgane, beispielsweise in Gestalt von Randausneh-

10

15

20

25

mungen, mit 18 bezeichnet sind. In entsprechender Weise sind an den Seitenwänden 10 der Evakuier-platteneinheit 8 Angriffsorgane 19 vorgesehen.

Ist also beispielsweise durch einen Roboter-Manipulator die Mikrotiterplatte 6 zwischen die Haltewinkel 5 der Mikrotiterplattenhalterung eingesetzt worden, was bei von der Gerätebasisplatte 1 abgenommener Evakuierplatteneinheit 8 geschieht, mittels kann danach einer Pipettiereinrichtung ein Befüllen der Probenbehältnisse 7 der Mi-krotiterplatte 6 geschehen, falls dies nicht zuvor bereits vor Einsetzen der Mikrotiter-platte 6 in die Mikrotiterplattenhalterung geschehen ist.

Sodann wird die Evakuierplatteneinheit 8 über die Schütteltischplatte 3 und die befüllte Mikrotiterplatte 6 gestülpt, so daß die rundumlaufende Dichtung 11 am unteren Rand der Seitenwände 10 auf der nach oben weisenden Fläche der Gerätebasisplatte 1 aufliegt.

Wird jetzt die Verbindung des Innenraumes der Evakuierplatteneinheit 8 zu einer Vakuumquelle über den Anschluß 14, den Evakuierungskanal 13 und die Mündungsöff-nung 12 hergestellt, SO saugt sich bei abgesperrtem Belüftungskanal 16 die Evakuier-platteneinheit 8 an der Gerätebasisplatteneinheit fest und es wird ein Vakuum im Innen-raum der Evakuierplatteneinheit 8 erzeugt, das über sämtlichen Probenbehältnissen 7 wirksam ist. Dieses Vakuum kann so eingestellt werden, daß selbst bei Umgebungstem-peratur (beispielsweise 20°C) der Inhalt der Probenbehältnisse 7 zum Sieden kommt, derart, daß Suspensionsträgerflüssigkeit oder Lösungsflüssigkeit in den Proben inner-halb der Probenbehältnisse 7 verdampft und die Proben aufkonzentriert werden.

Durch gleichzeitiges Einschalten des Schüttelantriebs 4 wird erreicht, daß die Proben an den Innenwänden der Probenbehältnisse 7 kreisen und dadurch gegen-

10

15

20

25

es mer ...

über der evakuierten Umgebung innerhalb der Evakuierplatteneinheit 8 eine große Oberfläche darbieten. Zusätzlich hat die Schüttelbewegung aufgrund der auf die Proben wirkenden Zentrifugalkräfte den Effekt, daß eine Blasenbildung oder Schaumbildung in den Pro-ben beim Sieden unter vermindertem Druck eingeschränkt und ein Siedeverzug vermieden wird. Hierauf war eingangs schon eingegangen worden.

Die Ausführungsform nach Fig. 3 unterscheidet sich von derjenigen nach Fig. 2 in erster Linie dadurch, daß die Evakuierplatteneinheit 8, welche die Oberseite der Mikro-titerplatte 6 überspannt, hier mit ihren Seitenwänden 10 nach abwärts zu einem außer-halb des Randes der Mikrotiterplatte gelegenen, rundumlaufenden, nach oben weisen-den Randbereich der Schütteltischplatte 3 reicht und gegenüber dieser, welche gegen-über der Umgebung strömungsmitteldicht ausgebildet ist, durch eine rundumlaufende Dichtung 11 abgedichtet werden kann. Im Randbereich der Oberseite der Schüttel-tischplatte 3 zwischen den Seitenrändern der Mikrotiterplatte 6 und der Innenwand der Seitenwände 10 der Evakuierplatteneinheit 8 befinden sich die Mündungsöffnung 12 eines Evakuierkanales 13 und die Mündungsöffnung 15 eines Belüftungskanales 16, wobei aber im Verlauf des Evakuierkanales 13 zwischen der Mündungsöffnung 12 und dem Anschluß 14 an der Gerätebasisplatte 1 bei der Ausführungsform nach Fig. 3 ein elastisch verformbarer Kanalabschnitt 20 vorgesehen ist, und im Verlauf des Belüf-tungskanales 16 zwischen der Mündungsöffnung 15 und dem Anschluß 17 der Geräte-basisplatte 1 ein elastisch verformbarer Kanalabschnitt 21 vorgesehen ist. Die elastisch verformbaren Kanalabschnitte 20 und 21, welche beispielsweise die Gestalt flexibler Schlauchabschnitte haben, dienen zum Herstellen der Vakuumverbindung bzw. Belüf-tungsverbindung unter Ausgleich der horizontalen Schüttelbewegungen zwischen der Gerätebasisplatte 1 und der Schütteltischplatte 3 bei in Betrieb befindlichem Schüt-telantrieb 4.

15

20

25

Im übrigen sind auch bei der Ausführungsform nach Fig. 3 an den Seitenrändern der Mikrotiterplatte 6 und an den Seitenwänden 10 der Evakuierplatteneinheit 8 Robo-ter-Manipulator-Angriffsorgane 18 bzw. 19 vorgesehen, deren Funktion im Zusammen-hang mit der Beschreibung der Ausführungsform nach Fig. 2 schon erläutert wurde.

Fig. 4 zeigt eine Ausführungsform, bei der die Evakuierplatteneinheit 8 in Auf-sicht im wesentlichen mit der Mikrotiterplatte 6 fluchtet und gegenüber deren die Mün-dungen der Probenbehältnisse 7 umgebenden, nach oben weisenden Rand mittels einer Dichtung 11 am unteren Rand der Seitenwände 10 abgedichtet werden kann, sobald der Innenraum der Evakuierplatteneinheit 8 evakuiert wird.

In einem nicht von den Mündungen der Probenbehältnisse 7 eingenommenen Be-reich der Mikrotiterplatte 6 ist diese mit Durchführungskanalabschnitten versehen, deren obere Enden von den wiederum mit 12 und 15 bezeichneten Mündungsöffnungen gebil-det sind und die mit entsprechenden Durchführungskanalabschnitten fluchten und über Ringdichtungen in der Trennfläche abgedichtet sind, wobei diese weiteren Durchfüh-rungskanalabschnitte nach abwärts durch die Schütteltischplatte 3 verlaufen. Diese durch die Schütteltischplatte 3 verlaufenden Durchführungskanalabschnitte gehen dann in die flexiblen Kanalabschnitte 20 bzw. 21 des Evakuierungskanals 13 bzw. des Be-lüftungskanals 16 über, um die 1 Schüttelbewegungen zwischen der Gerätebasisplatte und der Schütteltischplatte 3 auszugleichen, derart, daß wiederum schließlich die Mündungsöffnung 12 mit dem Anschluß 14 für die Vakuumquelle und die Mündungsöff-nung 15 mit dem Anschluß 17 für die Belüftungsquelle in Verbindung gesetzt werden. Im übrigen entsprechen Aufbau und Wirkungsweise Ausführungsform Fig. 4, auch bezüglich der Roboterder nach Manipulator-Angriffsorgane 18 und 19, im Aufbau bzw. der Wirkungsweise den zuvor beschriebenen Ausführungsformen.

10

15

20

25

Es sei hier angemerkt, daß aus Gründen der übersichtlichen Darstellung die Verti-kalabmessungen insbesondere der Evakuierplatteneinheit 8 und auch der Schütteltisch-platte 3 stark übertrieben dargestellt sind. Praktisch ist jedenfalls darauf Wert gelegt, daß der Schwerpunkt der durch den Schüttelantrieb 4 translatorisch bewegten Massen vergleichsweise wenig über den Schüttelantrieb 4 aufragt, um ein durch Trägheitskräfte bewirktes Aufkippen des Schütteltisches und darauf angeordneter plattenförmiger Bau-teile und Massen zu vermeiden.

Zu den Ausführungsformen nach den Figuren 2 bis 4 sowie auch den nachfolgend zu beschreibenden Ausführungsformen ist allgemein noch zu sagen, daß selbstverständ-lich zwischen den aufeinandersetzbaren bzw. voneinander abhebbaren plattenförmigen Geräteeinheiten Indexmittel zur präzisen Ausrichtung vorgesehen sind, etwa Indexstifte und Index-Bohrungen, übergreifende Flanschteile und dergleichen, wobei aber in den Zeichnungen diesbezügliche Einzelheiten weitestgehend zur Vereinfachung der Dar-stellung weggelassen sind.

In den Figuren 5A und 5B ist im Vertikalschnitt, teilweise schematisch, der rechte Teil bzw. der linke Teil einer Ausführungsform des grundsätzlichen Aufbaus nach Fig. 2 gezeigt, wobei jedoch die Probenbehandlungsstation nach den Figuren 5A und 5B aufgrund bestimmter Weiterbildungen und besonderer Ausgestaltungen eine Reihe zu-sätzlicher Funktionen und besonderer Behandlungsmaßnahmen ermöglicht.

Die Ausführungsform nach den Figuren 5A und 5B enthält wiederum eine Gerä-tebasisplatte 1, eine Schütteltischplatte 3, einen zwischen diesen beiden Platten wirksa-men Schüttelantrieb 4 und auf der Schütteltischplatte 3 vorgesehene Haltemittel zum lösbaren Aufsetzen einer Mikrotiterplatte 6. Schwingstützen nach der Art der Bauele-mente 2 von Fig. 1 sind in der Darstellung nach den Figuren 5A

und 5B ebenso wegge-lassen wie in der Darstellung nach den Figuren 2 bis 4, sind jedoch in Bereichen außer-halb der für die Darstellung gewählten Querschnittsebene vorgesehen, um die Schüttel-tischplatte 3 vertikal und in einer horizontalen Ebene beweglich abzustützen.

5

10

15

20

25

In die Gerätebasisplatte 1 ist ein Evakuierungskanal 13 eingeformt, der zu einer Mündungsöffnung 12 auf der Oberseite der Gerätebasisplatte 1 führt. Auf die Geräteba-sisplatte ist eine haubenförmige Evakuierungsplatteneinheit 8 aufgesetzt, welche Sei-tenwände 10 aufweist, an deren unterem Ende eine rundumlaufende Dichtung 11 für eine vakuumdichte Abdichtung gegenüber der Gerätebasisplatte 1 sorgt, sobald der Evakuierungskanal 13 an eine Vakuumquelle angeschlossen ist und die Evakuierplat-teneinheit 8 gegen die Gerätebasisplatte 1 ansaugt. Bei der Ausführungsform nach den Figuren 5A und 5B kann auch ein Belüftungskanal mit einer der Mündungsöffnung 12 entsprechenden Belüftungsöffnung vorgesehen sein, wobei jedoch diesbezügliche Ein-zelheiten bei der vorliegend betrachteten Darstellung weder gezeichnet noch unbedingt erforderlich sind.

Auf der Schütteltischplatte 3, welche eine thermisch isolierende Schicht enthalten kann, die in den Figuren 5A und 5B nicht eingezeichnet ist, befindet sich ein Flächen-heizelement 24, und auf diesem eine Wärmeverteilungsplatte 25, von der, einstückig an die Wärmeverteilungsplatte angeformt, Wärmeübertragungsnoppen in Gestalt zylindri-scher Stifte 26 aufragen. Die Wärmeübertragungsnoppen 26 bilden auf der Wärmever-teilungsplatte 25 eine Matrixanordnung, welche mit der Matrixanordnung von Probebe-hältnissen 7 der Mikrotiterplatte 6 übereinstimmt, derart, daß jeweils eine nach aufwärts weisende Oberfläche der Wärmeübertragungsnoppen 26 der Bodenfläche eines Proben-behältnisses 7 gegenübersteht.



10

15

20

25

Über die Oberenden der Wärmeübertragungsnoppen 26 ist eine Wärmeübertra-gungsschicht aus gut wärmeleitendem Schaumkunststoff 27 gebreitet, welche längs ih-rer Außenränder rundum gegenüber einem Randflansch der Wärmeübertragungsplatte 25, oder in Abwandlung hiervon, gegenüber einem Randflansch, welcher von der Schütteltischplatte 3 aufragt, derart abgedichtet ist, daß zwischen der Oberseite der Wärmeverteilungsplatte 25 und der Unterseite der Wärmeübertragungsschicht 27 rund um die Wärmeübertragungsnoppen 26 ein abgeschlossener Raum gebildet ist.

Von diesem Raum aus führt eine Durchführungskanalanordnung 28 bzw. 29, wel-che die Wärmeverteilungsplatte 25, das Flächenheizelement 24 und die Schütteltisch-platte 23 durchdringt, zu einem Schlauchansatz der Schütteltischplatte, von wo aus ein flexibler Schlauchabschnitt 30 bzw. 31 zum Ausgleich von der 1 und Gerätebasisplatte Schüttelbewegungen zwi-schen der Schütteltischplatte 3 zu einem Schlauchansatz eines in der Gerätebasisplatte 1 eingeformten Kanalsystems 32 bzw. 33 führt. Über die-ses Kanalsystem ist der unterhalb Wärmeverteilungsplatte der und oberhalb der . 25 um die 27 gelegene Raum Wärmeübertragungsschicht Wärmeübertragungsnoppen 26 herum, welcher mit 34 bezeichnet ist, zu einem nachfolgend im einzelnen erläuterten Zwecke an einen äußeren Kühlmittelkreislauf anschließbar. Dichtmittel zum Abdichten der Wärmeverteilungsplatte 25 gegenüber dem Flächenheizelement 24 und gegenüber der Schütteltischplatte 3 im Bereich der Durchführungskanalanordnung 28 bzw. 29 sind zur Vereinfachung der Darstellung nicht eingezeichnet, jedoch werden solche Dicht-mittel vom Fachmann ebenso vorgesehen wie ausreichend bemessene Durchbrüche in dem Flächenheizelement 24 zum Durchleiten der Durchführungskanalanordnung 28 bzw. 29.

10

15

20

25

Aus Fig. 5A ist noch zu ersehen, daß das Flächenheizelement 24 über durch eine Leitungsdurchführung 35 verlegte flexible elektrische Zuleitungen 36 zum Ausgleichen der Relativbewegungen zwischen der Gerätebasisplatte 1 und der Schütteltischplatte 3 mit einem Anschluß 37 der Gerätebasisplatte 1 zum Zuleiten elektrischer Heizenergie zum Flächenheizelement 24 verbunden ist.

Im Unterschied zu der in Fig. 2 nur schematisch dargestellten Ausführungsform hat bei der Ausführungsform nach den Figuren 5A und 5B die Evakuierplatteneinheit 8 einen auf einen von den Seitenwänden 10 gebildeten Rahmen aufgeschraubten und durch eine Dichtung 38 abgedichteten Deckel 9. Unterhalb des Deckels 9 befindet sich innerhalb der durch die Seitenwände 10 definierten Umgrenzung eine flache Bega-sungskammer 39, welche durch eine auf einen Randflansch der Seitenwände 10 der Evakuierplatteneinheit 8 dicht aufgelegte Lochplatte 40 von dem unmittelbar über der Mikrotiterplatte 6 gelegenen Hauptraum der Evakuierplatteneinheit 8 getrennt ist.

Blasdüsen 41 der Lochplatte oder Blasdüsenplatte 40 bilden eine Matrixanord-nung, die mit Bezug auf die Vertikalrichtung der Matrixanordnung der Probenbehält-nisse 7 der Mikrotiterplatte 6 entspricht. Die Düsenkanäle der Blasdüsen sind also je-weils auf die entsprechenden Probenbehältnismündungen ausgerichtet, wobei die An-triebsamplitude des Schüttelantriebs 4 so gewählt ist, daß die aus den einzelnen Düsen-kanälen 41 austretenden und gegenüber der Gerätebasis 1 unveränderliche Lagen auf-weisenden Blasgasströme stets auf die Mündungsöffnungen der zugehörigen Probenbe-hältnisse allein treffen und sich nicht an Randbereichen um die Probenbehältnisöffnun-gen herum verwirbeln.

Aus Fig. 5B ist ersichtlich, daß die flache Kammer 39, die auch die Gestalt eines Blasmittel-Führungskanalsystems haben kann, das in den Deckel 9 der Evakuierplatten-einheit 8 eingeformt ist, was allerdings nicht dargestellt ist, über einen

10

15

sich durch die Seitenwand 10 der Evakuierplatteneinheit 8 erstreckenden Durchführungskanalabschnitt 42 und einen weiteren Durchführungskanalabschnitt 43 in der Gerätebasisplatte 1 Ver-bindung zu einem steuerbar mit einem bestimmten Blasgas beaufschlagbaren Zufüh-rungskanal 44 der Gerätebasisplatte 1 Verbindung hat.

Zur Vorbereitung einer Probenbehandlung wird die Evakuierplatteneinheit 8 von Probenbehandlungsstation abgenommen und es wird Mikrotiterplatte 6 passend auf die Schütteltischplatte 3 aufgesetzt, wobei die Mikrotiterplattenhalterung und/oder gesonderte Ausrichtmittel sicherstellen, daß jeweils der Boden eines Pobenbehältnis-ses 7 über Wärmeübertrangungsnoppen 26 der Wärmeverteilungsplatte 25 zu liegen kommt und aufgrund der Nachgiebigkeit der zwischengelagerten, gut wärmelei-tenden Wärmeübertragungsschicht 27 aus wärmeleitendem Schaumstoff eine innige thermische Kopplung zwischen dem Flächenheizelement 24 über die Wärmeverteilungsplatte 25, die Wärmeübertragungsnoppen 26 und die Wärmeübertragungsschicht 27 sowie schließlich den Boden des jeweiligen Probenbehältnisses zur Probe hin zustande kommt.

20 Sodann wird die Evakuierplatteneinheit 8 auf die Gerätebasisplatte 1 aufgesetzt und der Innenraum wird über die Mündungsöffnung Gerätebasisplatte 1 sowie den Anschluß 13 durch Verbinden desselben mit einer Vakuumquelle evakuiert. Wird der Schüttelantrieb 4 eingeschaltet, so erfolgt ein Durchmischen der Probenbehältnisse 7 und gleichzeitig ein Sieden beispielsweise 25 bei Umgebungstemperatur aufgrund des Va-kuums innerhalb der Evakuierplatteneinheit zum schonenden Aufkonzentrieren der Pro-ben.

Um bei der Aufkonzentration kurze Prozesszeiten zu erreichen, ist zusätzlich zur Evakuierung die Zufuhr von Heizleistung notwendig, wozu den Proben durch

10

15

20

25

Anschalten des Flächenheizelementes 24 an eine elektrische Leistungsquelle Wärme-energie zugeführt wird.

Ist ein bestimmtes Behandlungsergebnis, beispielsweise eine bestimmte Konzen-tration der Proben in den Probenbehältnissen 7, erreicht, was durch den von in der Zeichnung nicht gezeigten Detektoren detektierten Temperaturanstieg in den Proben oder in den über den Anschluß 13 abgezogenen Dämpfen ermittelt werden kann, so ist es wünschenswert, nunmehr die Wärmezufuhr zu den Proben sehr rasch zu beenden. Zu diesem Zwecke wird dann die elektrische Energiezufuhr zu dem Flächenheizelement abgeschaltet und über die Anschlüsse 32 und 33, die flexiblen Leitungsverbindun-gen 30 und 31, die Durchführungskanalanordnung 28, 29 und den Raum 34 um die Wärmeübertragungsnoppen 26 herum wird ein Kühlmittelkreislauf zur Wirkung ge-bracht, welcher eine sehr rasche Absenkung der Temperatur der Böden der Probenbe-hältnisse 7 und der Probenbehältnissen zum Stillstand gebracht werden kann.

Während des Einwirkens des Vakuums auf die Proben in sämtlichen Probenbe-hältnissen 7 durch Evakuieren des Innenraums der Evakuierplatteneinheit 8 können in die einzelnen Probenbehältnisse 7 Blasgasströme über die Düsenkanäle 41 von dem Blasmittel-Zuführungsraum 39 aus eingeführt werden, wobei diese Blasgasströme die Wirkung haben, daß, selbst bei stillgesetztem Schüttelantrieb 4, die Oberfläche der Probe, welche dem Vakuum ausgesetzt ist vergrößert wird, was den Verdampfungsvor-gang fördert. Bei in Betrieb befindlichen Schüttelantrieb 4 haben die einzelnen Blas-gasströme, welche in den Innenraum der Probenbehältnisse 7 eintreten, auch die Wir-kung von Rührorganen zur Auflösung der Oberfläche wiederum zur Verbesserung des Verdampfungsverhaltens. Da bei der Ausführungsform nach den Fig. 5A und 5B die Blasgasströme relativ zur Gerätebasisplatte 1 stillstehen, während die

10

15

20

Mikrotiterplatte 6 aufgrund der Einschaltung des Schüttelantriebs 4 translatorische kreisende Bewegung ausführt, bewirken die Blasgasströme nicht nur eine Auflösung der Oberfläche zur Ver-besserung des Verdampfungsverhaltens, sondern bewirken auch ein Niederhalten und Zerstören von ansonsten aufsteigenden Gasblasen und aufsteigendem Schaum.

Man erkennt, daß über den Zuführungskanal oder Anschluß 44 das Blasgas, bei-spielsweise Kohlendioxid oder ein Inertgas, nicht notwendigerweise mit erhöhtem Druck zugeführt werden muß. Vielmehr kann die Gaszuführung über den Zuführungs-kanal 44 auch mit Umgebungsdruck oder gar mit niedrigerem Druck erfolgen, da es für die Entwicklung der Blasgasströme auf den Druckunterschied zwischen dem Blasmittel-Zuführungsraum 39 und dem Innenraum der Evakuierplatteneinheit 8 ankommt.

Es hat sich gezeigt, daß mit Ausführungsformen von Probenbehandlungsstationen etwa nach den Fig. 5A und 5B ein schonendes Aufkonzentrieren von Proben mit ver-hältnismäßig geringer äußerer Wärmezufuhr unter Einsatz von auf die Proben in Pro-benbehältnissen gerichteter Blasgasströme in Zeiten möglich war, welche nur die Hälfte der bei herkömmlicher Behandlung erforderlichen Zeiten betrug. Dabei erweist es sich als sehr vorteilhaft, daß die Temperierung, die Erhitzung und die Abkühlung oder Rückkühlung in sehr engen Grenzen von Probenbehältnis zu Probenbehältnis in gleicher Weise gesteuert werden kann.

Anstelle der Wärmezufuhr zu den Proben über das Flächenheizelement 24, die Wärmeverteilungsplatte 25 und die Wärmeübertragungsnoppen 26 sowie die Wärme-übertragungsschicht 27 oder aber auch zusätzlich zu diesem Heizsystem kann ein Tem-perieren, Erhitzen oder Abkühlen der Proben in dem Probenbehältnissen durch eine in Fig. 6 schematisch gezeigte Anordnung vorgenommen werden. Bei der Ausbildung des Heizsystems der Probenbehandlungsstation der hier

10

15

20

25

angegebenen Art gemäß Fig. 6 hat die Mikrotiterplatte 6 auf dem Niveau der Probenbehältnis-Mündungsöffnungen eine durchgehende Probenbehältnis-Verbindungsplatte 46 und auf dem Niveau der Proben-behältnis-Unterenden ist entweder ein dichter Abschluß durch die Auflage auf eine ela-stisch nachgiebige Matte gegeben oder auch auf diesem Niveau ist eine durchgehende Probenbehältnis-Verbindungsplatte vorgesehen, wobei der Raum um die einzelnen Probenbehältnisse 7 herum nach oben und nach unten sowie auch längs der seitlichen Rän-der der Mikrotiterplatte 6 abgedichtet ist. Über eine außerhalb des Bereiches der Pro-benbehältnisse 7 nach unten aus der Mikrotiterplatte 6 ausmündende und durch die Schütteltischplatte reichende Durchführungskanalanordnung 47 bzw. 48 sowie über flexible Leifungsverbindungen 49 bzw. 50 zur Gerätebasisplatte 1 hin ist der abge-schlossene Raum seitlich um die Probenbehältnis-Außenwände 7 herum mit einem Heizmittelkreislauf oder einem Kühlmittelkreislauf steuerbar verbindbar, wobei der äußere Teil Heizmittelkreislaufs des Kühlmittelkreislaufs in Fig. 6 mit 51 bezeich-net ist.

Durch mehrere strichpunktierte Linien 52 sind in Fig. 6 Strömungsleitwände schematisch angedeutet, die in den Räumen zwischen den Probenbehältnissen 7 und der oberen und unteren Probenbehälnis-Verbindungsplatte eingebaut sind, um eine weitest-gehend gleichmäßige Umströmung der Außenwände der einzelnen Probenbehältnisse und damit eine von Probenbehältnis zu Probenbehältnis im wesentlichen gleichförmige Wärmeübertragung zwischen den Proben und dem Wärmetauschmittel zu erreichen. Wird das Heizsystem gemäß Fig. 6 zusätzlich zu dem anhand der Fig. 5A und 5B er-läuterten Heizsystem in einer Probenbehandlungsstation nach den Fig. 5A und 5B ein-gesetzt, so zeigt es sich, daß eine individuelle Temperierung, Kühlung und Heizung verschiedener Niveaus der Füllhöhe der Probe in den Probenbehältnissen 7 nach einem vorbestimmten Programm beliebig vorgenommen werden kann.

10

15

20

25

Fig. 7 zeigt eine praktische Ausgestaltung einer Probenbehandlungsstation der hier angegebenen Art gemäß der grundsätzlichen Konstruktion nach Fig. 4, wobei hier allerdings auf der Mikrotiterplatte 4 eine mit dieser fest verbundene Mündungskanal-platte 53 angeordnet ist, die mit der Mikrotiterplatte fest verbunden, beispielsweise ver-schweißt ist. Auf dem Niveau der Ausmündungen der Probenbehältnisse 7 der Mikroti-terplatte 4 befindet sich eine Probenbehältnis-Verbindungsplatte 54 und von der Mün-dungskanalplatte 53 ragen Kanalansätze 55 einstückig zu den einzelnen Probenbehält-nissmündungen. Die Kanalansätze 55 haben die Gestalt von Rohrflanschen mit unteren, einstückig angeformten Schwappschutzringen 56 mit pyramidenstumpfförmigem Ringquerschnitt. Die von der Mündungsöffnung der Probenbehältnisse 7 nach einwärts gerichteten Schwappschutzringe 56 bewirken, daß auch bei vergleichsweise größerer Füllhöhe der Proben in den Probenbehältnissen 7 der Probeninhalt bei kräftigen Schüt-telbewegungen der Schütteltischplatte 3 bzw. der Mikrotiterplatte 4 nicht aus dem jeweiligen Probenbehältnis herausgeschleudert wird.

Zwischen der oberen Probenbehältnis-Verbindungsplatte der Mikrotiterplatte 4 und der Unterseite der Mündungskanalplatte 53 ist ein die Mündungskanalansätze um-gebendes und seitlich längs der oberen Ränder der Mikrotiterplatte 4 abgedichtetes Ka-nalsystem 57 gebildet, das über eine durch die Mikrotiterplatte 4 hindurch und durch die Schütteltischplatte 3 hindurch reichende Durchführungskanalanordnung 58 bzw. 59 sowie über flexible Leitungsverbindungen 60 bzw. 61 zur Gerätebasisplatte 1 hin steu-erbar an den äußeren Teil 62 eines Kühlmittelkreislaufs anschließbar ist. Der Wämeent-zug im Bereich der Mündungsöffnung der Probenbehältnisse 7 bewirkt bei bestimmten Behandlungsmaßnahmen eine Verminderung des Probenverlustes durch ungewünschtes Abdampfen und kann auch dazu beitragen eine Probenüberhitzung. zuverlässig zu ver-meiden, da das Kanalsystem bzw. die Räume 57 unabhängig von den übrigen Wärme-tauscheinrichtungen willkürlich rasch mit Kühlmittel

beaufschlagt werden kann. Es sei hier bemerkt, daß auch die in Zusammenhang mit den Fig. 5A und 5B erwähnten Blas-gasstrahlen aus den diesen Kanälen 41, falls das Blasgas gekühlt ist, zu einer Proben-kühlung beitragen und eine Probenüberhitzung zu vermeiden helfen.

5

10

15

Auf den oberen Rand der Mündungskanalplatte 53 ist abdichtend die Evakuier-platteneinheit 8 aufgesetzt, deren Innenraum wie in Fig. 7 nicht gezeigt ist, über eine die Mündungskanalplatte 53, die Mikrotiterplatte 4 und die Schütteltischplatte 3 durchdrin-gende Durchführungskanalanordnung sowie über flexible Leitungsabschnitte mit einem Vakuumanschluß bzw. Belüftungsanschluß der Gerätebasisplatte 1 verbunden ist, in ganz entsprechender Weise, wie dies für die Ausführungsform nach Fig. 4 beschrieben wurde.

Gemäß einem sehr vorteilhaften Merkmal der Ausführungsform nach Fig. 7 ist die Mündungskanalplatte 53 auf ihrer Oberseite mit einer Reihe von Stütznoppen 63 verse-hen, gegen welche sich der Deckel 9 der Evakuierplatteneinheit 8 abstützen kann, wenn der Innenraum der Evakuierplatteneinheit 8 evakuiert wird und der Deckel 9 das Bestre-ben hat, sich durchzubiegen.

20

25

Eine entsprechende Anordnung von Stütznoppen kann auch auf der Oberseite der Probenbehältnis-Verbindungsplatte der Mikrotiterplatte 6 bei der Ausführungsform nach den Fig. 3 und 4 vorgesehen sein. Sind solche Stütznoppen auf der Oberseite der Mikrotiterplatte 6 gemäß Fig. 3 vorgesehen, so haben diese Stütznoppen den zusätzli-chen Vorteil, daß bei sich unter Vakuumeinwirkung leicht nach unten durchwölbendem Deckel 9 die Mikrotiterplatte 6 durch eine zusätzliche Haltekraft gegen die Oberseite der Schütteltischplatte 3 gedrückt wird und so eine zusätzliche Fixierung während des Schüttelbetriebes erfährt.

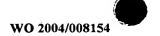
10

15

20

Bestimmte Proben oder bestimmte Suspensionsträgerflüssigkeiten oder Lösungs-mittel haben solche Konsistenz bzw. Zähigkeit, daß selbst bei hohen Schüttelfrequenzen keine ausreichende Durchmischung mehr erzielt werden kann. Auch kleine Probenbe-hältnisse bedingen aufgrund von Oberflächen- und Trennflächenerscheinungen oft eine erschwerte Durchmischung. In diesen Fällen kann es zweckmäßig sein, in die einzelnen Probenbehältnisse einer Mikrotiterplatte Rührorgane in miniaturisierter Ausführung einzuführen. Gemäß einer in der Zeichnung nicht gezeigten Ausführungsform kann an der nach unten weisenden Wand des Deckels 9 der Evakuierplatteneinheit 8 oder an der Unterseite einer an dieser vorgesehenen Blasdüseneinheit eine Matrixanordnung von Rührstiften vorgesehen sein, wobei die Matrixanordnung im zusammengesetzten Zu-stand der Probenbehandlungsstation auf solchem Niveau an der Evakuierplatteneinheit angeordnet ist, daß bei an Vakuum angeschlossener und gegen die Gerätebasisplatte abgedichteter Evakuierplatteneinheit die einzelnen je einem Probenbehältnis 7 der Mi-krotiterplatte 6 zugeordneten Rührstifte mit ihren unteren Enden in die zugehörigen Probenbehältnisse reichen, ohne den Boden der Probenbehältnisse zu berühren. Die Lage der Rührstifte innerhalb der Matrixanordnung ist so gewählt und die Antriebsam-plitude des Schüttelantriebs wird so eingestellt, daß die Rührstifte im Betrieb und natür-lich auch im Ruhezustand die Wände der Probenbehältnisse nicht berühren. Die Rühr-wirkung kommt dadurch zustande, daß bei stillstehenden Rührstiften sich die Probenbe-hältnisse zusammen mit ihrem Probeninhalt translatorisch kreisend um die Rührstifte bewegen.

Bei der in Fig. 7 gezeigten Ausführungsform ist auf die Mikrotiterplatte 6
25 eine mit Vakuum-Durchgriffsöffnungen versehene Rührstiftplatte durch einen Roboter-Manipu-lator abnehmbar oder aufsetzbar aufgelegt, welche eine Matrixanordnung nach abwärts reichender, je einem Probenbehältnis 7 zugeordneter
Rührstifte oder Rührlöffel 65 trägt. Die Rührstiftplatte liegt lose auf der Oberseite
der Mündungskanalplatte 53 auf, wobei die Vakuum-Durchgriffsöffnungen der



10

15

20

25

Rührstiftplatte 64 und Durchbrüche in den Rührlöffeln 65 die Möglichkeit geben, ohne Abnehmen der Rührstiftplatte 64 nach Trennen der Evakuierplatteneinheit 8 von dem übrigen Gerät die Probenbehältnisse 7 durch eine Pipettiereinrichtung zu befüllen bzw. zu entleeren. Die Rührstiftplatte 64 trägt Indexmittel, beispielsweise Indexdurchbrüche, und von der Mikrotiterplatte oder Mündungskanalplatte 53 ragen Gegen-Indexmittel, etwa in Gestalt der Stütznoppen 63 auf, derart, daß bei Schüttelbewegungen der Schütteltischplatte 3 und damit der Mikrotiterplatte 6 und der Mündungskanalplatte 53 die Rührstiftplatte 64 innerhalb eines bestimmten Spiels aufgrund ihrer trägen Relativbewegungen zur Mikroti-terplatte ausführt und somit die Rührlöffel 65 Bewegungen in den Probenbehältnissen 7 ausführen und den Probeninhalt innig durchmischen, wobei dafür Sorge getragen ist, daß aufgrund der Bemessung des Spiels zwischen der Rührstiftplatte 64 und der Mün-dungskanalplatte 57 bzw. der Mikrotiterplatte 6 die Rührlöffel 65 weder am Boden noch an den Innenwänden der Probenbehältnisse 7 anlaufen.

Der Fachmann erkennt, daß die in Fig. 7 gezeigte Ausführungsform auch noch dahingehend weitergebildet werden kann, daß über der Evakuierplatteneinheit 8 eine dicht auf diese aufsetzbare und von ihr wieder abnehmbare Blasdüseneinheit vorgesehen wird. Von der Blasdüsen-Platteneinheit aus ist dann wiederum getrennt von den ande-ren, in Fig. 7 gezeigten Kanalverbindungen eine gesonderte Durchführungskanalanord-nung durch die Mündungskanalplatte 57, durch die Mikrotiterplatte 6 und durch die Schütteltischplatte 3 zu flexiblen Leitungsverbindungen zu Anschlüssen der Geräteba-sisplatte 1 zu führen, um die Blasdüsen-Platteneinheit an eine Quelle für ein Blasgas oder Inertgas anschließen zu können.

Fig. 7 zeigt weiterhin die Möglichkeit auf, in den Probenbehältnissen 7 der Mi-krotiterplatte 6 eine Durchmischung oder Separation mittels Magnetperlen, insbeson-dere mittels beschichteter Magnetperlen, vorzunehmen. Zu diesem

10

15

Zwecke ist auf die Schütteltischplatte 3, und, genauer gesagt, auf die mit den Wärmeübertragungsnoppen 26 versehene Wärmeverteilungsplatte 25 eine Dauermagnetsockel-Verbindungsplatte 66 aufgelegt, welche mit einer Matrixanordnung von Durchbrüchen versehen ist, durch die die Wärmeübertragungsnoppen 26 der-Wärmeverteilungsplatte 25 hindurchreichen. Von der Dauermagnetsockel-Verbindungsplatte 66 ragen in den Bereich zwischen einer je-weiligen Vierergruppe von Behältnis-Unterenden Dauermagnetsockel 67 nach aufwärts, die an ihren oberen Enden Dauermagnetringe 68 tragen. Die Dauermagnet-Verbin-dungsplatte 66 ist wiederum mit Roboter-Manipulator-Angriffsorganen versehen, derart, daß sie auf die Schütteltischplatte 3 bzw. auf die Wärmeverteilungsplatte 25 mit den Wärmeübertragungsnoppen 26 roboterbetätigt aufgesetzt werden kann, bevor über die Dauermagnetsockel-Verbindungsplatte dann die Mikrotiterplatte 6 mit der Mündungs-kanalplatte 57 und über diese dann die Evakuierplatteneinheit 8 gesetzt wird, letzteres gegebenenfalls erst nach roboterbetätigtes Auflegen der Rührstiftplatte 64.

In Fig. 7 sind durch den Dauermagnetring 68 aus den Proben der vier benachbar-ten Probebehältnisse 7 separierte Magnetperlenansammlungen an der Probenbehältnis-wand mit 69 bezeichnet.

Ansprüche

1. Probenbehandlungsstation, welche folgendes enthält:

5

- eine Gerätebasisplatte (1);
- eine gegenüber dieser vertikal abgestützte (2) und in einer Horizontalebene beweglichen Schütteltischplatte (3);

10

einen zwischen diesen beiden Platten angeordneten und mit ihnen gekoppelten Schüttelantrieb (4) zur Horizontalbewegung der Schütteltischplatte im wesentlichen ausschließlich translatorisch, mit Mitteln zur Stillsetzung der Schütteltischplatte in einer präzisen Ruhestellung;

15

eine auf der Schütteltischplatte (3) vorgesehenen Mikrotiterplattenhalterung (5); und

20

- eine in die Halterung entnehmbar eingesetzte, eine Vielzahl von Probenbehältnissen (7) aufweisende Mikrotiterplatte (6), deren Probenbehältnisse mittels einer automatisch betätigten Befüllungs- und Entnahmeeinrichtung mit Proben befüllbar bzw. entleerbar sind;

25 .

dadurch gekennzeichnet, daß über der Mikrotiterplatte (6) eine diese überspannende Evakuierplatteneinheit (8) abnehmbar angeordnet ist, die so abdichtbar ausgebildet ist, daß sie in allen Probenbehältnissen der Mikrotiterplatte (6) ein Vakuum zu erzeugen gestattet und die über Anschlüsse (14, 17) der Gerätebasisplatte (1) steuerbar mit einer Vakuumquelle bzw. einer Belüftungsquelle verbindbar ist.

15

20

25

- 2. Probenbehandlungsstation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß den unteren Enden der Probenbehältnisse (7) Wärme von einer auf der Schütteltischplatte (3) vorgesehenen elektrischen Flächenheizeinrichtung (24) zuführbar ist, die über flexible Leitungen (36) mit einem Leistungszuführungsanschluß (37) der Gerätebasisplatte (1) verbunden ist.
- 3. Probenbehandlungsstation nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Flächenheizeinrichtung auf der Schütteltischplatte (3) eine über einem Flächenheizelement angeordnete metallische Wärmeverteilungsplatte (25) aufweist, von der einstückig Wärmeübertragungsnoppen (26) aufragen, die jeweils dem unteren Ende eines zugehörigen Probenbehältnisses (7) zugeordnet sind.

4. Probenbehandlungsstation nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß sich zwischen den Wärmeübertragungsnoppen (26) und den Probenbehältnis-Unterenden eine durchgehende, nachgiebige Wärmeübertragungsschicht (27), insbesondere in Gestalt einer wärmeleitenden Schaumstoffmatte, befindet.

5. Probenbehandlungsstation nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Raum über der Wärmeverteilungsplatte (25) und unter der Wärmeübertragungsschicht (27) um die Wärmeübertragungsnoppen (26) herum längs der seitlichen Schütteltischplattenränder abgedichtet ist und über eine die Wärmeverteilungsplatte (25), das Flächenheizelement (24) und die Schütteltischplatte (3) durchdringende Durchführungskanalanordnung (28, 29)

sowie flexible Leitungsabschnitte (30, 31) zur Gerätebasisplatte (1) hin steuerbar an einen Kühlmittelkreislauf anschließbar ist.

5 6. Probenbehandlungsstation nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikrotiterplatte (6) auf dem Niveau der Bodenbehältnis-Unterenden und/oder auf den Niveau der Probenbehältnis-Mündungsöffnungen eine durchgehende Probenbehältnis-Verbindungsplatte aufweist, daß der Raum um die einzelnen Probenbehältnisse (7) herum oberhalb bzw. unterhalb der Probenbehältnis-Verbindungsplatte sowie längs der seitlichen Mikrotiterplattenränder abgedichtet ist und über eine bis zur Unterseite der Schütteltischplatte reichende Durchführungskanalanordnung (47, 48) sowie über flexible Leitungen (49, 50) zur Gerätebasisplatte (1) hin steuerbar an einen Heizmittelkreislauf und/oder einen Kühlmittelkreislauf anschließbar ist.

15

Probenbehandlungsstation nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß sich über der bzw. einer die Probenbehältnisse (7) auf den Niveau ihrer Mündungsöffnungen verbindenden Probenbehältnis-Verbindungsplatte eine mit der Mikrotiterplatte (6) fest verbundene Mündungskanalplatte (53) befindet, von der einstückig insbesondere mit unteren Schwappschutzringen (56) versehene Kanalansätze (55) zu den einzelnen Probenbehältnismündungen reichen und daß der Raum über der Probenbehältnisverbindungsplatte und unter der Mündungskanalplatte um die einzelnen Kanalansätze (55) herum längs der seitlichen Mikrotiterplattenränder abgedichtet ist und über eine durch die Mikrotiterplatte (6) hindurch schließlich bis unter die Schütteltischplatte (3) reichende Durchführungskanalanordnung (58, 59) und flexible Leitungsabschnitte (60, 61) zur Gerätebasisplatte (1) hin steuerbar an einen Kühlmittelkreislauf (62) anschließbar ist.

- 8. Probenbehandlungsstation nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß über der Evakuierplatteneinheit (8) eine Blasdüsenplatteneinheit (39, 40) mit einer der Zahl der Probenbehältnisse (7) der Mikrotiterplatte (6) entsprechenden Anzahl von Blasdüsen (41) vorgesehen ist, deren Düsenkanäle, jeweils auf die entsprechende Probenbehältnismundung ausgerichtet. eine Mikrotiterplatte zugekehrte Wand Evakuierungsplatteneinheit durchdringen und sämtlich mit einem Blasmittel-Zuführungsraum (39)oder einem Blasmittel-Zuführungskanalsystem verbunden sind, der bzw. das steuerbar mit einer Blasgasquelle verbunden ist.
- Probenbehandlungsstation nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn zeichnet, daß die Evakuierplatteneinheit (8) seitliche Wände (10) aufweist, deren unterer Rand gegenüber der gasdicht zur Umgebung hin ausgebildeten Gerätebasisplatte (1) lösbar dicht abschließt (11).
- 20 10. Probenbehandlungsstation nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebsamplitude des Schüttelantriebs (4) so gewählt ist, daß die aus den einzelnen Düsenkanälen (41) austretenden, gegenüber der Gerätebasisplatte (1) unveränderliche Lage aufweisenden Blasgasströme stets auf die Mündungsöffnung des zugehörigen Probenbehältnisses allein treffen.

5

10

11. Probenbehandlungsstation nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Evakuierplatteneinheit (8) seitliche Wände (10) aufweist, deren unterer Rand gegenüber der gasdicht zur Umgebung hin ausgebildeten

10

15

25

Schütteltischplatte (3) um den Mikrotiterplatten-Seitenrand herum lösbar dicht abschließt und daß der Innenraum der Evakuierplatteneinheit über eine die Schütteltischplatte (3) durchdringende Durchführungskanalanordnung und über flexible Leitungsabschnitte (20, 21) zur Gerätebasisplatte (1) mit der Vakuumquelle bzw. der Belüftungsquelle steuerbar verbindbar ist.

- 12. Probenbehandlungsstation nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Evakuierplatteneinheit (8) seitliche Wände (10) aufweist, deren unterer Rand gegenüber einem sämtliche Probenbehältnismündungsöffnungen umschließenden Dichtrand der Mikrotiterplatte (6) lösbar dicht abschließt, und daß der Innenraum der Evakuierplatteneinheit über eine die Mikrotiterplatte (6) und die Schütteltischplatte (3) durchdringende Durchführungskanalanordnung (12, 13, 15, 16) und über flexible Leitungsabschnitte zur Gerätebasisplatte (1) mit der Vakuumquelle bzw. der Belüftungsquelle steuerbar verbindbar ist.
- 13. Probenbehandlungsstation nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Oberseite der Mikrotiterplatte (6) bzw. auf der Oberseite einer darauf aufgesetzten Mündungskanalplatte (53) zwischen Probenbehältnismündungen gelegene Stütznoppen (63) aufragen, gegen die sich die nach unten weisende Wandfläche der Deckenwand der Evakuierplatteneinheit bei Vakuumeinwirkung auf deren Innenraum abstützt.

14. Probenbehandlungsstation nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß an der Unterseite der Evakuierplatteneinheit (8) eine mit dieser fest verbundene oder fest verbindbare Matrixanordnung von Rührstiften vorgesehen

Ţ

ist, wobei die Matrixanordnung auf solches Niveau an der Evakuierplatteneinheit eingestellt oder einstellbar ist, daß bei an Vakuum angeschlossener und gegen die Gerätebasis abgedichteter Evakuierplatteneinheit die einzelnen je einem Probenbehältnis der Mikrotiterplatte zugeordneten Rührstifte mit ihren unteren Enden in die zugehörigen Probenbehältnisse reichen, ohne deren Boden zu berühren, wobei die Lage der Rührstifte in der Matrixanordnung und die Antriebsamplitude des Schüttelantriebs so eingestellt sind, daß im Betrieb und im Ruhezustand die Rührstifte nicht in Berührung mit den Probenbehältnis-Innenwänden kommen.

10 ...

15

20

25

5

15. Probenbehandlungsstation nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikrotiterplatte (6), welche Indexmittel aufweist, eine mit Vakuum-Durchgriffsöffnungen versehene Rührstiftplatte (64) abnehmbar aufgesetzt ist, welche eine Matrixanordnung nach abwärts weisender, je einem Probenbehältnis (7) zugeordneter Rührstifte oder Rührlöffel trägt, die bei auf der Mikrotiterplatte aufliegender Rührstiftplatte mit deren unteren Enden in die zugehörigen Probenbehältnisse (7) reichen, ohne deren Boden zu berühren, wobei die Rührstiftplatte (64) mit den Indexmitteln der Mikrotiterplatte über ein horizontales Bewegungsspiel zusammenwirkende Gegen-Indexmittel aufweist und die Lage der Rührstifte in der Matrixanordnung und das horizontale Bewegungsspiel so gewählt sind, daß im Betrieb und im Ruhezustand des Schüttelantriebs (4) die Rührstifte nicht in Berührung mit den Probenbehältnis-Innenwänden kommen, und wobei die träge Masse der Rührstiftplatte und ihre Reibverbindung zur Mikrotiterplatte so bemessen sind, daß im Betrieb des Schüttelantriebs die Rührstiftplatte innerhalb des genannten horizontalen Bewegungsspiels Relativbewegungen gegenüber der Mikrotiterplatte ausführt.

من مرات

- 16. Probenbehandlungsstation nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Rührstiftplatte (64) eine auf die Probenbehältnismündungen der Mikrotiterplatte ausgerichtete Matrixanordnung von Durchbrüchen aufweist, von deren Berandung die Rührstifte oder Rührflügel jeweils nach abwärts ragen, und welche zum Befüllen und Entleeren der Probenbehältnisse ohne Abnahme der Rührstiftplatte von der Mikrotiterplatte dienen.
- 17. Probenbehandlungsstation nach einem der Ansprüche 1 bis 16, bei welcher die Mikrotiterplatte auf dem Niveau der Probenbehältnis-Unterenden und/oder auf dem Niveau der Probenbehältnis-Mündungsöffnungen eine Probenbehältnis-Verbindungsplatte aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß im Bereich zwischen einer jeweiligen Vierergruppe von Probenbehältnis-Unterenden bzw. von Probenbehältnis-Mündungsöffnungen Dauermagnetsockel-Durchtrittsöffnungen vorgesehen sind und daß eine Dauermagnetsockel-Matrixanordnung sich entweder unter der Mikrotiterplatte oder über der Mikrotiterplatte befindet, deren Dauermagnetsockel entweder von unten nach aufwärts oder von oben nach abwärts durch die Dauermagent-Durchtrittsöffnungen in die Räume zwischen den Vierergruppen von Probenbehältnissen einschiebbar sind.

20

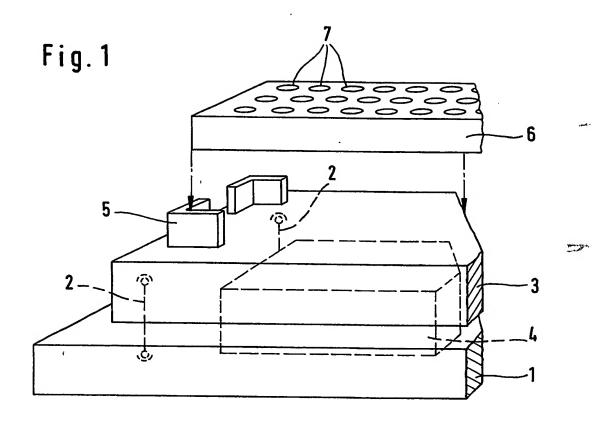
25

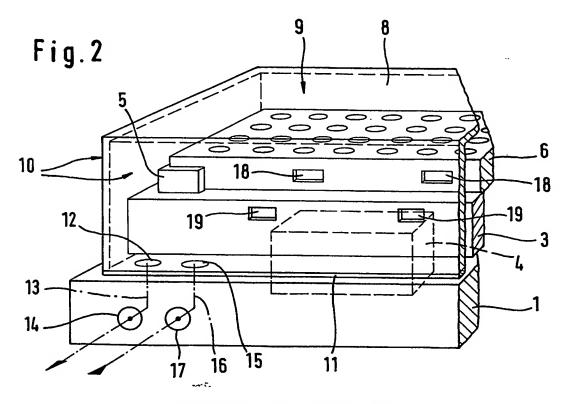
5

- 18. Probenbehandlungsstation nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Dauermagnetsockel (67) von einer Dauermagnetsockel-Verbindugsplatte (66) wegragen, die unter bzw. über der Mikrotiterplatte von dieser trennbar angeordnet ist.
- 19. Probenbehandlungsstation nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß relativ zu der Gerätebasisplatte (1) und der darauf abge-

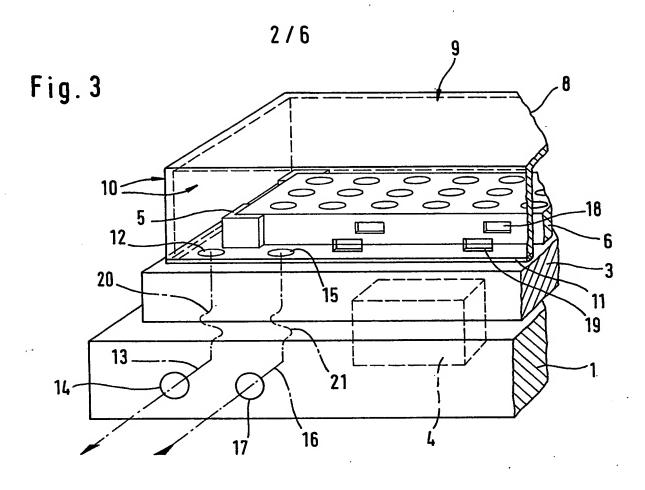
stützten Schütteltischplatte (3) die Mikrotiterplatte (6), eine bzw. die gegebenenfalls unter oder über dieser angeordnete Dauermagnetsockelplatte, eine oder die gegebenenfalls über der Mikrotiterplatte (6) angeordnete Rührstiftplatte (64), die die Mikrotiterplatte (6) überspannende Evakuierplatteneinheit (8) Roboter-Manipulator-Angriffsorgane zur Zusammenwirkung mit dem Manipulator eines einzigen Roboters aufweisen und in gewünschter Auswahl aufstapelbar bzw. voneinander trennbar sind.

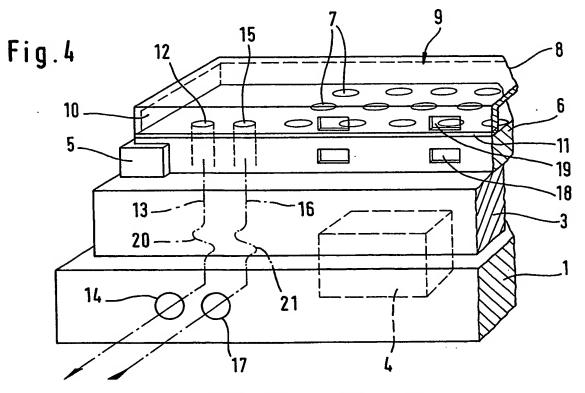
5





ERSATZBLATT (REGEL 26)





ERSATZBLATT (REGEL 26)

3/6

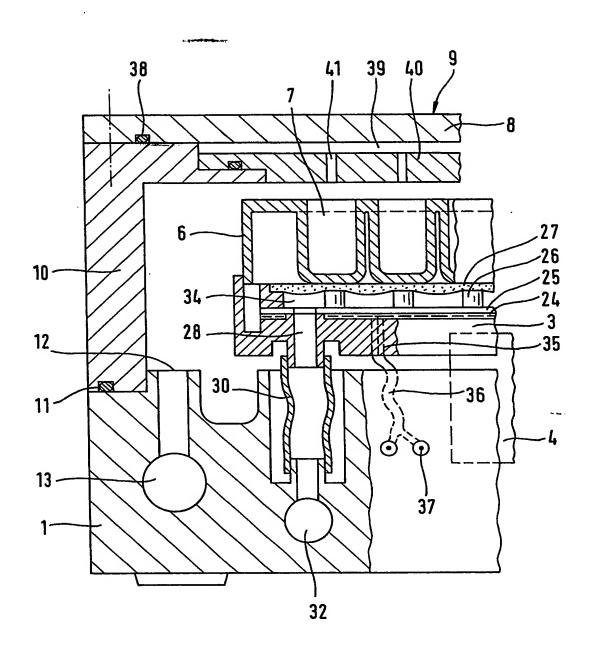


Fig.5A

4/6

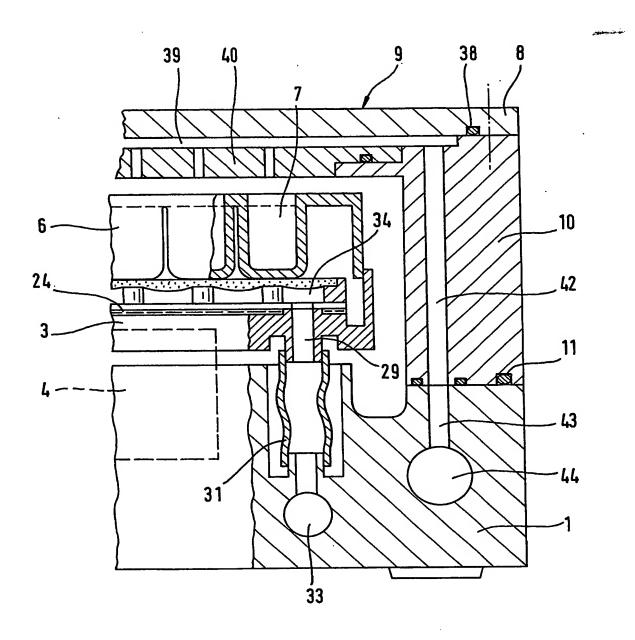


Fig.5B

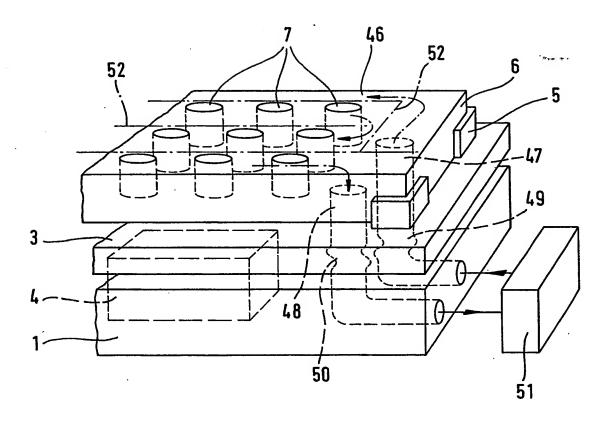
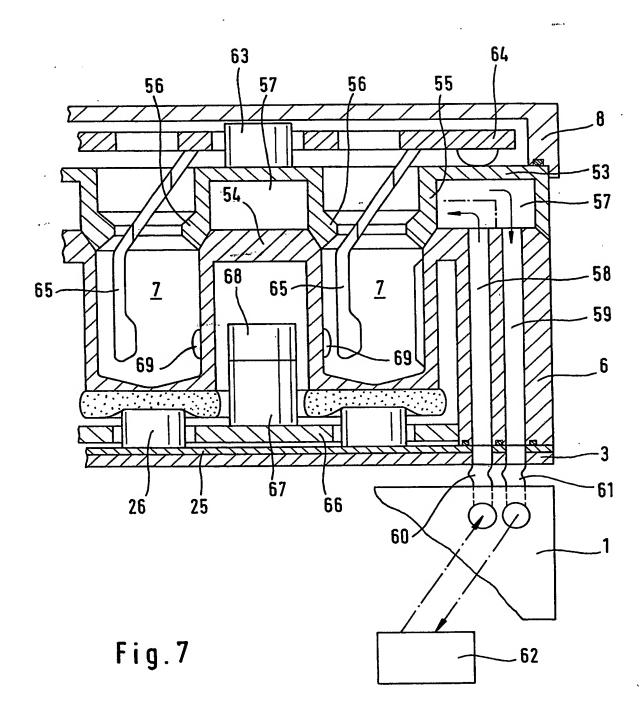


Fig.6





Application No Internati

PCT/EP 03/07653 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G01N35/02 G01N GO1N1/40 B01F11/00 B01F13/06 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G01N B01F B01L IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to daim No. US 4 054 151 A (PARKER BERNARD ET AL) 1,2,6-1218 October 1977 (1977-10-18) the whole document Y EP 1 201 297 A (HERZ HELMUT ; KAUFMANN 1,2,6,7, 11,12 KLAUS (DE)) 2 May 2002 (2002-05-02) abstract; figure 1 Y WO OO 25925 A (DOEBELIN WERNER ; HETTLAB AG 8-10 (CH)) 11 May 2000 (2000-05-11) abstract; figure 1 page 1, line 5 - line 10 page 2, line 5 - line 30 page 3, line 4 - line 19 EP 0 281 958 A (HOECHST AG) 8.9 A 14 September 1988 (1988-09-14) abstract; figure 1 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the International "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when t document is combined with one or more other such docu "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 05/11/2003 23 October 2003 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV RISWIJK Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fac (+31-70) 340-3016

Bockstahl, F



Internation Application No
PCT/EP 03/07653

		PCT/EP 03/07653
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 98 20965 A (DOEBELIN WERNER) 22 May 1998 (1998-05-22) abstract; figure 1	1
A	WO 98 20975 A (EPPENDORF GERAETEBAU NETHELER; LURZ WERNER (DE); BRUST RUEDIGER (D) 22 May 1998 (1998-05-22) abstract; figure 1 page 2, line 10 -page 5, line 3	1
A	US 5 061 448 A (BIVER WILLIAM R ET AL) 29 October 1991 (1991-10-29) abstract; figure 1 column 1, line 47 - line 68	1
Α	US 5 571 283 A (VOLLGOLD GUENTER) 5 November 1996 (1996-11-05) abstract; figure 2 column 1, line 35 -column 2, line 23	1
		- ·



Information on patent family members

Internation Application No PCT/EP 03/07653

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
US 4054151	Α	18-10-1977	US	3944188	A	16-03-1976
EP 1201297	Α	02-05-2002	DE	20018633	 U1	18-01-2001
			EP	1201297	A1	02-05-2002
WO 0025925	Α	11-05-2000	AT	245490	T	15-08-2003
			AU	6457499	A	22-05-2000
			WO	0025925		11-05-2000
			DE	59906386		28-08-2003
			EP	1126918		29-08-2001
			JP	2002528266		03-09-2002
			US	6482363	B1	19-11-2002
EP 0281958	A	14-09-1988	DE	3707368	A1	15-09-1988
			AU	1264588		08-09-1988
•			DK	119288		08-09-1988
			EP	0281958		14-09-1988
			FI	880988		08-09-1988
			JP	63242335		07-10-1988
			NO	880974	Α	08-09-1988
WO 9820965	A	22-05-1998	CH	688987	A5	15-07-1998
			ΑU	4860297	Α	03-06-1998
			WO	9820965		22-05-1998
			DE	59704898	D1	15-11-2001
			EP	0946279		06-10-1999
	•		JP	2001504030	T	27-03-2001
WO 9820975	Α	22-05-1998	DE	19646115	A1	14-05-1998
			DE	29623597	U1	07-01-1999
			WO	9820975	A1	22-05-1998
		•	EP	0881950	A1	09-12-1998
			JP	2000504231	T	11-04-2000
US 5061448	Α	29-10-1991	EP	0339824	A1	02-11-1989
			JP	1317384	Α	22-12-1989
US 5571283	A	05-11-1996	DE	4300748	A1	21-07-1994
	• •		DE	59306680		10-07-1997
			WO	9415705		21-07-1994
			EP	0630284		28-12-1994
			ĒS	2104337		01-10-1997

Internet Pes Aktenzeichen
PCT/EP 03/07653

PCT/EP 03/07653 KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES K 7 G01N35/02 G01N1/40 B01F11/00 B01F13/06 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 GOIN BOIF B01L Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. US 4 054-151 A (PARKER BERNARD ET AL) 1,2,6-1218. Oktober 1977 (1977-10-18) das ganze Dokument EP 1 201 297 A (HERZ HELMUT ; KAUFMANN 1,2,6,7, KLAUS (DE)) 2. Mai 2002 (2002-05-02) 11,12 Zusammenfassung; Abbildung 1 WO 00 25925 A (DOEBELIN WERNER ; HETTLAB AG Y 8-10 (CH)) 11. Mai 2000 (2000-05-11) Zusammenfassung; Abbildung 1 Seite 1, Zeile 5 - Zeile 10 Seite 2, Zeile 5 - Zeile 30 Seite 3, Zeile 4 - Zeile 19 Α EP 0 281 958 A (HOECHST AG) 8,9 14. September 1988 (1988-09-14) Zusammenfassung; Abbildung 1 -/--Weltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamille Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *L' Veröffentlichung, die geelgnet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmetidedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 23. Oktober 2003 05/11/2003

Bevollmächtigter Bedlensteter

Bockstahl, F.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5816 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016



Internal les Aktenzelchen
PCT/EP 03/07653

		PCT/EP 03	P 03/07653		
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie	Bezelchnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
A	WO 98 20965 A (DOEBELIN WERNER) 22. Mai 1998 (1998-05-22) Zusammenfassung; Abbildung 1		1		
A	WO 98 20975 A (EPPENDORF GERAETEBAU NETHELER ;LURZ WERNER (DE); BRUST RUEDIGER (D) 22. Mai 1998 (1998-05-22) Zusammenfassung; Abbildung 1 Seite 2, Zeile 10 -Seite 5, Zeile 3		1		
A	US 5 061 448 A (BIVER WILLIAM R ET AL) 29. Oktober 1991 (1991-10-29) Zusammenfassung; Abbildung 1 Spalte 1, Zeile 47 - Zeile 68		1		
А	US 5 571 283 A (VOLLGOLD GUENTER) 5. November 1996 (1996-11-05) Zusammenfassung; Abbildung 2 Spalte 1, Zeile 35 -Spalte 2, Zeile 23		1		
	-				
	·				
	•				
		()() + <u>#</u>			
	·				
	·				



Internation a Aktenzeichen
PCT/EP 03/07653

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 40	054151	A	18-10-1977	US	3944188	A	16-03-1976
EP 12	201297	A	02-05-2002	DE EP	20018633 1201297		18-01-2001 02-05-2002
WO 00	025925	A	11-05-2000	AT AU WO DE EP JP US	245490 6457499 0025925 59906386 1126918 2002528266 6482363	A A1 D1 A1 T	15-08-2003 22-05-2000 11-05-2000 28-08-2003 29-08-2001 03-09-2002 19-11-2002
EP 02	281958	A	14-09-1988	DE AU DK EP FI JP NO	3707368 1264588 119288 0281958 880988 63242335 880974	A A A2 A	15-09-1988 08-09-1988 08-09-1988 14-09-1988 08-09-1988 07-10-1988 08-09-1988
WO 98	820965	A	22-05-1998	CH AU WO DE EP JP	688987 4860297 9820965 59704898 0946279 2001504030	A A1 D1	15-07-1998 03-06-1998 22-05-1998 15-11-2001 06-10-1999 27-03-2001
WO 9	820975	A	22-05-1998	DE DE WO EP JP	19646115 29623597 9820975 0881950 2000504231	U1 A1	14-05-1998 07-01-1999 22-05-1998 09-12-1998 11-04-2000
US 5	061448	Α	29-10-1991	EP JP	0339824 1317384		02-11-1989 22-12-1989
US 5	571283	A	05-11-1996	DE DE WO EP ES	4300748 59306680 9415705 0630284 2104337	D1 A1 A1	21-07-1994 10-07-1997 21-07-1994 28-12-1994 01-10-1997

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
MAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.